

DFM A/S Prislister 2018

Gyldig fra 1. marts 2018

All priser er excl. moms

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	Salgspris [DKK]
DC elektrisk kalibrering				
K02.001	JA	Kalibrering af spændingsreferencenormal (Zener)	STK	17675,00
K02.099	Kontakt DFM	Elektrisk måling/kalibrering, sekundær, ifølge tilbud.	STK	
K02.999	Kontakt DFM	Elektrisk måling/kalibrering ifølge tilbud.	STK	
Termometri				
K02.101	JA	Termometrisk kalibrering, kontakt, ét temperaturpunkt	STK	500,00
K02.102	JA	Termometrisk kalibrering, kontakt, flg. termometer, samme temp.	STK	100,00
K02.103		Termometrisk kalibrering, certifikat	STK	1000,00
K02.199	Kontakt DFM	Termometrisk kalibrering, ifølge tilbud	STK	
K02.299	Kontakt DFM	Termometrisk kalibrering, kontaktfri (IR), ifølge tilbud	STK	
Tryk				
K02.399	Kontakt DFM	Trykkalibrering, ifølge tilbud	STK	
Ledningsevnekalibrering				
K03.001	JA	Karakterisering af opløsning ved 24°C-26°C	STK	5405,00
K03.002	JA	Efterfølgende måling på samme opløsning ved 24°C-26°C	STK	3685,00
K03.003	Nej	Karakterisering af opløsning ved 24°C-26°C uden certifikat	STK	4565,00
K03.004	JA	Karakterisering af opløsning ved 15°C-35°C	STK	6820,00
K03.005	Nej	Karakterisering af opløsning ved 10°C-60°C	STK	7010,00
K03.006	JA	Efterfølgende måling på samme opløsning ved 15°C-35°C	STK	4580,00
K03.099	Kontakt DFM	Karakterisering af opløsning ifølge tilbud	STK	
Kalibrering af ledningsevneceller og -målesystemer				
K03.101	JA	Kalibrering af ledningsevnesensor cellekonstant eller ledningsevnemålesystem, per målepunkt, mindst 3 pkt.	STK	3120,00
K03.102	JA	Kalibrering af sensor i CRM væsker ved 10 mS/m, 100 mS/m og 1 S/m i forbindelse med ledningsevnesensorkalibrering, per målepunkt, incl. CRM	STK	6625,00
K03.199	Kontakt DFM	Kalibrering af ledningsevnesensor cellekonstant eller ledningsevnemålesystem ifølge tilbud	STK	
Referenceelektrodekalibrering				
K03.201	JA	Bestemmelse af elektrokemisk referenceelektrodepotential	STK	7070,00
Længdekalibrering				
K04.001	JA	Måleklodskalibrering, første måleklods (1 klods)	STK	2105,00
K04.002	JA	Måleklodskalibrering, flg. 8 klodser (2-9) i samme sæt, pr. klods	STK	600,00
K04.003	JA	Måleklodskalibrering, pr. klods (10-) i samme sæt	STK	315,00
K04.004	JA	Kalibrering af måleklodser, M10 standard sæt	STK	7235,00
K04.005	JA	Kalibrering af måleklodser, M122 standard sæt	STK	42475,00

DFM A/S Prislister 2018

Gyldig fra 1. marts 2018

All priser er excl. moms

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	Salgspris [DKK]
K04.999	Kontakt DFM	Kalibrering af målekodser ifølge tilbud	STK	
Optisk radiometri kalibrering				
K05.001	JA	Kalibrering af detektor / powermeter ved ét effektniveau og én bølgelængde, synligt lys	STK	5710,00
K05.002	JA	Kalib. af detektor / powermeter, pr. flg. effektniveau eller bølgelængde, synligt lys	STK	3565,00
K05.020	JA	Kalibrering af detektor / powermeter ved ét effektniveau og én bølgelængde, NIR, 0.7 %	STK	4570,00
K05.021	JA	Kalibrering af detektor/powermeter, pr. følgende effektniveau eller bølgelængde, NIR, 0.7 %	STK	2855,00
K05.022	JA	Kalibrering af detektor / powermeter, ét effektniveau og én bølgelængde, NIR, 1.5 %	STK	2855,00
K05.023	JA	Kalibrering af detektor / powermeter, pr. flg. effektniveau eller bølgelængde, NIR, 1.5 %	STK	1920,00
K05.024	JA	Høj-effekt kalibrering af detektor/powermeter ved ét effektniveau og én bølgelængde, NIR	STK	4830,00
K05.040	Kontakt DFM	Spektralkalibrering af detektor/power meter 800 -1650 nm, pris fra	STK	10705,00
K05.041	JA	Linearitet af detektor/powermeter, -40 dBm til -5 dBm	STK	4280,00
K05.042	JA	Linearitet af detektor/powermeter, -60 dBm til -40 dBm	STK	860,00
K05.043	JA	Linearitet af detektor/powermeter, -5 dBm til +10 dBm	STK	860,00
K05.044	JA	Linearitet af detektor/power meter, -5 dBm til +23 dBm	STK	1430,00
K05.060	JA	Kalibrering af fiberoptisk attenuator, én bølgelængde	STK	3205,00
K05.070	Nej	Homogenitet af detektorer	STK	4010,00
K05.071	Nej	Kalibrering af udstyr til måling af laserstrålers diameter	STK	5500,00
K05.072	Nej	Klassificering af laser pr. bølgelængde	STK	4435,00
K05.080	JA	Kalibrering af optisk spektrumanalysator el. laserbølgelængde, ét måleområde	STK	4245,00
K05.081	JA	Kalibrering af optisk spektrumanalysator el. laserbølgelængde, to måleområder	STK	5420,00
K05.082	JA	Kalibrering af bølgeometer eller laserbølgelængde	STK	5550,00
K05.100	Nej	OTDR afstandskalibrering, SM, første måling ved én bølgelængde	STK	3585,00
K05.101	Nej	OTDR afstandskalibrering, SM, efterflg. måling eller bølgelængde	STK	1355,00
K05.201	Nej	Relative intensity noise (RIN), første måling, pr. kilde	STK	3730,00
K05.999	Kontakt DFM	Kalibrering af detektor/powermeter synligt lys ifølge tilbud	STK	
K05.999	Kontakt DFM	Radiometrisk måling / kalibrering, ifølge tilbud	STK	
Massekalibrering				
K06.001	JA	Kalibrering pr. lod ved 3 eller flere lodder	STK	995,00
K06.003	JA	Kalibrering af 1 eller 2 lodder	STK	2735,00
K06.999	Kontakt DFM	Kalibrering af lodder ifølge tilbud	STK	
Mikro- og nanometerskala kalibrering				
K07.001	JA	AFM kalibrering af todimensionalt gitter, første gitter	STK	5065,00
K07.002	JA	AFM kalibrering af todimensionalt gitter, følgende gitter, pr. stk.	STK	3905,00
K07.003	JA	AFM kalibrering af stephøjde	STK	4835,00
K07.101	Nej	Ruhedsmåling, billede & rå data. Måling på ét sted, første sted, første billede & første prøve	STK	3220,00
K07.102	Nej	Ruhedsmåling, billede & rå data. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	1550,00

DFM A/S Prislister 2018

Gyldig fra 1. marts 2018

All priser er excl. moms

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	Salgspris [DKK]
K07.103	Nej	Ruhedsmåling, samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1075,00
K07.104	Nej	Ruhedsmåling inkl. rapport. Måling på ét sted, første billede	STK	5725,00
K07.105	Nej	Ruhedsmåling inkl. rapport. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	2505,00
K07.106	Nej	Ruhedsmåling inkl. rapport. Samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1670,00
K07.107	Nej	Long range scan 500 µm x 500 µm x 6 µm inkl. rapport	STK	11395,00
K07.120	Nej	Kalibrering af optisk graticule (mikroplet normal, 8 mikropletter*), 1 µm - 50 µm; *Ved andet antal dots, kontakt os for tilbud	STK	11395,00
K07.140	Nej	Udmåling af lokalt overfladepotentiale (Kelvin Probe Mikroskopi)	STK	3190,00
K07.141	Nej	Udmåling af lokalt overfladepotentiale (Kelvin Probe Mikroskopi), inkl. rapport	STK	5695,00

Mikro- og nanometerskala kalibrering, overfladeundersøgelser

K07.201	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, billede & rå data. Måling på ét sted i væskecelle, første billede	STK	4410,00
K07.202	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, billede & rå data. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	2150,00
K07.203	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, billede & rå data. Samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1310,00
K07.204	Nej	Overfladeundersøgelser i væske inkl. rapport. Måling på ét sted i væskecelle, første billede	STK	6920,00
K07.205	Nej	Overfladeundersøgelser i væske inkl. rapport. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	3220,00
K07.206	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, inkl. rapport. Samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1905,00
K07.210	Nej	AFM måling af adhæsion, ifølge tilbud		
K07.211	Nej	AFM måling af strukturel stabilitet af overflader, ifølge tilbud		
K07.301	Nej	Brug af AFM facilitet (for erfarne brugere), excl. konsulentbistand, første dag	STK	2505,00
K07.302	Nej	Brug af AFM facilitet (for erfarne brugere), excl. konsulentbistand, efterfølgende dage, pr. dag	STK	1310,00
K07.303	Nej	Overfladeundersøgelser af eller sammen med videnskabelig medarbejder (inkl. rapportering). Tid registreres pr. påbegyndt 1/2 time. Pris er pr. time	TIME	1650,00
K07.999	Kontakt DFM	Udmåling af overflader, ifølge tilbud	STK	

Mikro- og nanometerskala kalibrering, interferens- og konfokalmikroskopi

K07.304	Kontakt DFM	Måling med konfokal/interferens-mikroskop, ifølge tilbud	STK	
K07.305	Nej	Karakterisering af silicium liniegitre (liniebredde (CD), højde samt vinkel af sidevæg), ifølge tilbud	STK	
K07.306	Nej	Ruhedsmåling med konfokal/interferens-mikroskop, første sted, måling og prøve	STK	2415,00
K07.307	Nej	Ruhedsmåling med konfokal/interferens-mikroskop, følgende sted eller måling, samme session/prøve	STK	985,00
K07.308	JA	Kalibrering af stephøjde med konfokal/interferens-mikroskop, første sted, måling og prøve	STK	3810,00
K07.309	JA	Kalibrering af stephøjde med konfokal/interferens-mikroskop, følgende sted eller måling, samme session/prøve	STK	3240,00
K07.310	JA	Lateral kalibrering af 2-dim. gitter med konfokal/interferens-mikroskop, første sted, måling og prøve	STK	3990,00
K07.311	JA	Lateral kalibrering af 2-dim. gitter med konfokal/interferens-mikroskop, følgende sted eller måling, samme session/prøve	STK	3080,00

DFM A/S Prislister 2018

Gyldig fra 1. marts 2018

All priser er excl. moms

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	Salgspris [DKK]
Mikro- og nanometerskala kalibrering, andet				
K07.399	NA	Specialspidser til AFM, ifølge tilbud	STK	
K07.405	Nej	Elipsometrisk måling af filmtykkelse/ optiske konstanter i ét punkt	STK	2850,00
K07.406	Nej	Elipsometrisk måling af filmtykkelse/ optiske konstanter i flere punkter ifølge tilbud	STK	
K07.501	Nej	Replikering af overflader med polymeraftryk, ifølge tilbud	STK	
K07.600	Nej	Profilometrisk måling, højde, ifølge tilbud	STK	
K07.601	Nej	Profilometrisk måling, form/lateral, ifølge tilbud	STK	
K07.602	Nej	Profilometrisk måling, ruhed, ifølge tilbud	STK	
K07.998	Kontakt DFM	Måling af Youngs Modulus, ifølge tilbud	STK	
K07.999	Kontakt DFM	Udmåling af overflader, ifølge tilbud	STK	
Akustisk kalibrering				
K08.001	JA	Mikrofon, tryk, reciprocitet, LS1	STK	11055,00
K08.002	JA	Mikrofon, tryk, reciprocitet, LS2	STK	11055,00
K08.003	JA	Mikrofon, fritfelt, reciprocitet, LS1	STK	18525,00
K08.004	JA	Mikrofon, fritfelt, reciprocitet, LS2	STK	22100,00
K08.005	JA	Mikrofon, fritfelt sammenligning (LS1, LS2, WS1 eller WS1)	STK	5525,00
K08.006	JA	Mikrofon, fritfelt sammenligning (som K08.005, grundydelse)	STK	3075,00
K08.007	JA	Som K08.006, flg. mikrofon pr. stk., samme målesession	STK	2565,00
K08.008	JA	Mikrofon, tryk sammenligning (LS1, LS2, WS1 og WS1)	STK	5525,00
K08.009	JA	Mikrofon, tryk sammenligning (som K08.008, grundydelse)	STK	3600,00
K08.010	JA	Mikrofon, HF-kalibrering, fritfelt reciprocitet WS3	STK	22100,00
K08.011	JA	Mikrofon, HF-kalibrering, fritfelt sammenligning WS3	STK	6450,00
K08.012	JA	Mikrofon, HF-kalibrering (som K08.011, grundydelse)	STK	4420,00
K08.201	JA	Aktuatorrespons (LS1, LS2, WS1 og WS1)	STK	2035,00
K08.202	JA	Aktuatorrespons, (LS1, LS2, WS1 og WS1), grundydelse	STK	1285,00
K08.203	JA	Aktuatorrespons, HF til 100 kHz	STK	2825,00
K08.204	JA	Aktuatorrespons, HF til 100 kHz, grundydelse	STK	2005,00
K08.205	JA	Kalibrering af pistonfon	STK	3240,00
K08.206	JA	Kalibrering af lydkalibrator (én frekvens)	STK	2925,00
K08.207	JA	Kalibrering af lydkalibrator (én frekvens), grundydelse	STK	2210,00
K08.301	JA	Øresimulator, kalibrering jvf. IEC 60318-1, IEC 60318-4	STK	5860,00
K08.101	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, egenstøj, iflg. tilbud	STK	
K08.102	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, membraninspektion, iflg. tilbud	STK	
K08.103	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, temp. koefficient, iflg. tilbud	STK	
K08.104	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, koefficient for statisk tryk, iflg. tilbud	STK	
K08.105	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, DC lækagetest, iflg. tilbud	STK	
K08.999	Kontakt DFM	Akustik måling / kalibrering ifølge tilbud	STK	
Partikel-tællerkalibrering og udmåling af partikler				
K09.001	JA	Kalibrering af tælleeffektivitet (CE), én partikel-tæller, ved én partikelstørrelse	STK	3240,00
K09.002	JA	Udvidelse af antal partikelstørrelser i kalibrering af CE, pris per yderligere størrelse, samme målesession	STK	2020,00
K09.003	Nej	Yderligere ISO 21501-4 afprøvninger jf. datablad, pr. tæller	STK	1065,00

DFM A/S Prislister 2018

Gyldig fra 1. marts 2018

All priser er excl. moms

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	Salgspris [DKK]
K09.006	Nej	Size Setting og Size Resolution, pr. ny partikelstørrelse	STK	1730,00
K09.007	Nej	Size Setting og Size Resolution, pr. CE partikelstørrelse	STK	865,00
K09.101	JA	Referencepartikler (100 nm - 5 µm diameter) kalibreret med AFM	STK	5805,00
K09.102	JA	Referencepartikler (100 nm - 5 µm diameter) kalibreret med AFM (kunde leverer selv partikler)	STK	4835,00
K09.999	Kontakt DFM	Partikelrelaterede målinger ifølge tilbud	STK	

Ruhed og koordinatmåling

K11.001	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Parameterkalibrering (1. forst. trin)	STK	5165,00
K11.002	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Forstærkningskalibrering (1. forst. trin)	STK	4590,00
K11.003	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Totalkalibrering (1. forst. trin)	STK	5740,00
K11.004	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Tillæg for efterflg. forstærkningstrin	STK	1720,00
K11.005	JA	Indjustering efter K11.001, og efterflg. parameterkal. (ét trin)	STK	3085,00
K11.100	JA	Kalibrering af ruhedsnormale; ISO Type C	STK	4020,00
K11.101	JA	Kalibrering af ruhedsnormale; ISO A1 (brede riller, plan bund) 2 riller	STK	4020,00
K11.102	JA	Kalibrering af ruhedsnormale; ISO A2 (brede riller, afrundet bund) 6 riller	STK	13200,00
K11.103	JA	Kalibrering af ruhedsnormale; ISO B2 (riller med enkelt form)	STK	4020,00
K11.108	JA	Kalibrering af ruhedsnormale; ISO D (profiler med uregelmæssig form, én retning)	STK	5165,00
K11.201	JA	Kalibrering af optomekanisk hulplade, prøvningsrapport, én position	STK	4175,00
K11.202	JA	Kalibrering af hulplade efter DKD retningslinier	STK	12470,00
K11.999	Kontakt DFM	Taktil prøvning af ruhed, ifølge tilbud	STK	

Ledningsevnerferenceopløsninger

R03.001	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H ₂ O, 0,01 S/m	STK	3505,00
R03.002	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H ₂ O, 0,1 S/m	STK	3505,00
R03.003	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H ₂ O, 1,0 S/m	STK	3505,00
R03.004	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H ₂ O, 10 S/m	STK	3505,00
R03.999	Kontakt DFM	Referenceopløsning, batch fremstillet på bestilling, ifølge tilbud	STK	

pH referenceopløsninger

R03.101	JA	Primær pH-buffer 'Ftalat' (pH=4,005)	STK	36980,00
R03.102	JA	Primær pH-buffer '1:1 fosfat' (pH = 6,865)	STK	36980,00
R03.103	JA	Primær pH-buffer '1:3.5 fosfat' (pH = 7,413)	STK	36980,00
R03.104	JA	Primær pH-buffer 'Borat' (pH = 9,180)	STK	36980,00
R03.105	JA	Primær pH-buffer 'Karbonat' (pH = 10,012)	STK	36980,00
R03.106	JA	Sekundær pH-buffer '1:4 fosfat' (pH = 7,38)	STK	36980,00

Bølgelængdereferencer

R05.001	NA	Absorptionscelle, inkl. vinduer og ventil	STK	3180,00
R05.002	NA	Absorptionscelle med 12C ₂ H ₂ (op til 101,3 kPa)	STK	5575,00
R05.003	NA	Absorptionscelle med 12CO (op til 101,3 kPa)	STK	5575,00
R05.004	NA	Absorptionscelle med 12CO ₂ (op til 101,3 kPa)	STK	5575,00
R05.005	NA	Absorptionscelle med 12CH ₄ (op til 101,3 kPa)	STK	5575,00

DFM A/S Prislister 2018

Gyldig fra 1. marts 2018

All priser er excl. moms

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	Salgspris [DKK]
R05.006	NA	Absorptionscelle med NH ₃ (op til 101,3 kPa)	STK	5575,00
R05.007	NA	Absorptionscelle med H ₂ S (op til 101,3 kPa)	STK	5575,00
R05.008	NA	Absorptionscelle med 13C ₂ H ₂ (op til 101,3 kPa)	STK	6365,00
R05.009	NA	Absorptionscelle med 13CO (op til 101,3 kPa)	STK	6365,00
R05.010	NA	Absorptionscelle med 12C18O (op til 40,0 kPa)	STK	7960,00
R05.011	NA	Holder til absorptionscelle	STK	3980,00
R05.012	NA	Holder til absorptionscelle og GRIN linser (inkl. to linser, monteret og linet op)	STK	15080,00
R05.013	NA	Montering af LED med SM fiber og FC/PC stik (ekskl. materialer)	STK	1845,00
R05.014	NA	LED monteret på Peltier køler og køleribber	STK	6365,00
R05.015	NA	Aluminiumskabinet m. stik for optiske fibre og elektriske forbindelser	STK	6365,00

DFM Software

S01.003	NA	DFM Calibration Datasheet 2000 til MS Excel, iflg. tilbud	STK	
S08.002	NA	Akustikprogram MP.EXE, version 4, ifølge tilbud	STK	
S08.003	NA	Opgradering til MP.EXE, version 4, ifølge tilbud	STK	

Konsulenttydelser

YDE1	NA	Konsulentydelse, Seniorforsker	TIME	1570,00
YDE2	NA	Konsulentydelse, Forsker	TIME	1255,00
YDE3	NA	Konsulentydelse, Tekniker	TIME	940,00

Priser er gældende fra den angivne dato indtil nye udsendes. Aktuelle priser findes til enhver tid på <http://www.dfm.dk>.
Ydelser udover de nævnte standardydelser faktureres til timepris efter aftale.
Priser er EXW og er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.